

X荧光测厚仪涂镀层检测

产品名称	X荧光测厚仪涂镀层检测
公司名称	昆山市玉山镇小麻雀精密仪器商行
价格	.00/台
规格参数	品牌:安原仪器
公司地址	江苏省苏州市昆山市花都艺墅105幢13楼
联系电话	13773131645

产品详情

XTU系列X荧光光普测厚度

仪器简介

XTU系列测厚仪虽然结构紧凑，但是都有大容量的开槽设计样品腔，即使超过样品腔尺度的工作也可以超过测试。

配搭微聚焦射线管和先进的光路设计，以及变焦算法装置，可测试极微小和异形样品。

检测78种元素镀层 · 0.005um检出限 · 小测量面积0.002mm² · 深凹槽可达90mm。

外置的高精密微型滑轨，可以快速控制样品移动，移动精密0.005mm，速度10-30mm(X-Y)/圈，再多的样品都没难度，让操作人员轻松自如。

应用领域

- 线路板,引线框架及电子元器件接插件检测
- 度纯金，K金，铂，银等各种饰品的膜层成分和厚度分析
- 手表，精密仪表制造行业
- 钕铁硼磁铁上的Ni/Cu/Cu/Ni/FeNdB
- 汽车，五金，电子产品等紧固件的表面处理检测
- 卫浴产品，装饰把手上的Cr/Ni/Cu/CuZn(ABS)

· 电镀液的金属阳离子检测

性能优势

· 下照式设计：可以快熟方便地定位对焦样品。

· 无损变焦检测：可对各种异性形凹槽进行无损检测，凹槽深度范围0-90mm。

· 为聚焦射线装置：可检测面积小于 0.002mm^2 的样品，可测试个微小的部件。

高效率的接收器：即使测试 0.01mm^2 以下的样品，几秒钟也能达到稳定性

· 精密微型滑轨：快速准确定位样品

· EFP先进算法软件：

多层多元素，甚至有同种元素在不同层也难不倒EFP算法软件

技术参数

元素分析范围：氯 (Cl)~铀 (U)

厚度分析范围：各种元素及有机物

一次性同时分析:23层镀层，24种元素

厚度出限:0.005um

小测量面积: 0.002mm^2 (多重准值器可选)

对焦距离:0~90mm (测试凹槽，可变焦)

样品腔尺寸:500mm × 360mm × 215mm (C型设计，允许测试超出样品腔板状物体)

仪器尺寸:550mm × 480mm × 470mm

仪器重量:55kg